

SIMPOSIO DE 2014
METROLOGÍA

20 ANIVERSARIO CENAM EN BENEFICIO DE LA NACIÓN

kg K mol A m cd s

6 al 10 de octubre 2014

Santiago de Querétaro, Qro. México

TEMAS GENERALES:

- La metrología en México, retos y perspectivas.
- La metrología en la industria.
- Desarrollo de patrones y sistemas de medición.
- Metrología en química y sus aplicaciones.
- Metrología en bioanálisis.
- La metrología en nanotecnología.
- Trazabilidad de las mediciones.
- Incertidumbre de la medición.
- Ensayos de aptitud
- Metrología legal y normalización.
- La metrología en la investigación científica.
- La metrología en la educación.

ACTIVIDADES:

- Cursos (6 y 7 de Octubre).
- Sesiones plenarias.
- Sesiones orales.
- Sesiones de pósters.
- Exposición industrial con proveedores especializados en equipo y servicios de medición.
- Encuentro Nacional de Metrología Eléctrica (ENME) 6 y 7 de octubre

Con motivo del vigésimo aniversario del CENAM, esta edición del Simposio de Metrología contará con la participación de expertos nacionales, internacionales, industriales, investigadores, docentes, fabricantes, proveedores de instrumentos y equipos de medición donde habrá intercambio de experiencias resaltando la importancia que tiene la metrología en diferentes ámbitos de la sociedad, en especial su impacto y evolución a través de estos años.

MAYORES INFORMES:

www.cenam.mx/simposio

Información general:

simposio@cenam.mx

Inscripciones:

inscripciones-simposio@cenam.mx

Tel.: +52 (442) 211 05 00 al 04, ext. 3013

Patrocinadores:

patrocinadores-simposio@cenam.mx

Tel.: +52 (442) 211 05 00 al 04,

ext. 3097

